**Informacja o odpowiedziach na pytania wykonawców oraz zmianie treści SWZ**

**Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

**Nr postępowania:** SZPiZ.261.8.2025

**Nazwa postępowania:**  Dostawa mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego opartego o monochromatory do pomiarów absorbancji, fluorescencji i luminescencji

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Pzp Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

1. Czy w punkcie 2.5 Zamawiający wskazując „Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej o 1 cm” rozumiał „Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej o wielkości 1 cm”?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, iż wskazując „Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej o 1 cm” rozumiał „Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej o długości 1 cm”

 **Pytanie 2:**

Czy w punkcie 3.3 Zamawiający wskazuje, iż urządzenie powinno posiadać szerokość połówkową pasma zmienną w zakresie 9-50nm z krokiem co 1nm?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wskazuje, iż moduł pomiaru fluorescencji z monochromatorami powinien jako metodę wyboru długości fali mieć: 2 monochromatory, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi, z zakresem długości fali 250-700 nm, z szerokością połówkową pasma dla monochromatorów regulowaną w zakresie 9-50nm z krokiem co 1nm.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający może doprecyzować czym skutkować będzie, jeśli w umówionym terminie instalacji i szkolenia z urządzenia stawi się mniej niż 5 osób, które mają zostać przeszkolone z obsługi urządzenia (punkt 6.6)?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający precyzuje, iż wymaga, aby wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia dla wszystkich zainteresowanych i obecnych osobiście osób z ramienia Zamawiającego, w dniu instalacji urządzenia. W przypadku, kiedy liczba osób zainteresowanych szkoleniem przekroczy 5 osób, Zamawiający zapewni dostęp do Sali seminaryjnej wyposażonej w rzutnik z przyłączem HDMI. W przypadku gdy na szkolenie stawi się mniej niż 5 osób Zamawiający nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Wykonawcy.

**Pytanie 4:**

Dotyczy punktu 7.2 – czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wbudowany inkubator komory pomiarowej 4-strefowy z możliwością ustawienia różnicy temperatur pracy górnych i dolnych grzałek w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na wieczku płytki, posiadający zakres temperatury pracy pomiędzy +4ºC względem temperatury otoczenia a 70°C?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w treści Załącznika nr 2 do SWZ.

**Pytanie 5:**

1. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny czytnik mikropłytek wyposażony w funkcję wytrząsania orbitalnego z możliwością regulacji zarówno amplitudy ruchu, jak i prędkości obrotowej w zakresie od 60 do 1200 obr./min?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie dopuszcza. Ze względu na charakter prowadzonych badań, Zamawiający potrzebuje zarówno funkcji wytrząsania liniowego, jak i orbitalnego oraz podwójnie orbitalnego.

**Pytanie 6:**

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające pomiar fluorescencji w zakresie wzbudzania od 200 do 1000 nm, emisji od 270 do 840 nm, z szerokością połówkową wiązki od 5 do 12 nm oraz zakresem dynamiki wynoszącym 6 dekad?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający nie dopuszcza. Szerokość połówkowa wiązki w zakresie od 5 do 12 nm zapewnia zbyt wąski zakres pod względem czułości prowadzonych pomiarów. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, którego monochromatory do pomiaru fluorescencji mają nieregulowaną szerokość połówkową szczeliny i/lub regulowaną w zakresie mniejszym niż między 9 a 50nm z krokiem większym niż 1nm. Ponadto zakres dynamiki wynoszący jedynie 6 dekad jest znacznie niższy, biorąc pod uwagę charakter wskazanej cechy technicznej, od wymaganego 7 dekad zakresu pomiaru fluorescencji, co będzie miało fundamentalny wpływ na wynik przeprowadzanych oznaczeń.

**Pytanie 7:**

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pomiarem luminescencji opartym na monochromatorze, o zakresie długości fali od 270 do 840 nm, zakresie dynamicznym wynoszącym 7 dekad oraz czułością pomiaru < 7 amol ATP/dołek?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w treści Załącznika nr 2 do SWZ.

**Pytanie 8:**

4. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do obsługi urządzenia, które nie posiada ograniczeń licencyjnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w treści Załącznika nr 2 do SWZ.

**Pytanie 9:**

5. Zamawiający wymaga, aby oferowany czytnik mikropłytek posiadał oznaczenie CE-IVD. Czy wymaganie to jest zasadne w kontekście zastosowania urządzenia w działalności naukowo-badawczej? Czy dopuszczalne jest zaoferowanie urządzenia posiadającego oznaczenie CE, lecz bez kwalifikacji IVD?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w treści Załącznika nr 2 i 4 do SWZ.

**Pytanie 10:**

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (gł. x szer. x wys.) 58 x 53 x 51 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Ze względu na dostępną przestrzeń oraz konieczność współdzielenia tej przestrzeni z innymi urządzeniami oraz konieczność posiadania miejsca do prawidłowej i komfortowej pracy manualnej Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, którego jakikolwiek wymiar przekracza 49 cm.

**Pytanie 11:**

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem regulacji temperatury od +4°C powyżej temperatury otoczenia do 45°C?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Ze względu na charakter i przebieg planowanych oznaczeń, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ponadto, jak określone w opisie przedmiotu zamówienia, aby wbudowany inkubator był 4-strefowy, z możliwością ustawienia różnicy temperatur grzałek górnych i dolnych w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na wieczku płytki.

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że dokonano zmian treści SWZ jak niżej:

1. W załączniku nr 2- Opis przedmiotu zamówienia-Formularz wymagań technicznych, zmienia się zapisy w sposób następujący:

Dotychczasowe zapisy dotyczące pkt. 4.2, 4.4, 4.5, 5.4, 6.3, 7.2 w brzmieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Zakres długości fali emisji w zakresie 300-700 nm | … |
| 4.4 | Zakres dynamiki: 6 dekad | … |
| 4.5 | Czułość pomiaru w szybkim teście ATP: 20 amol/dołek płytki 96-dołkowej |  |
| 5.4 | Ilość licencji (komputerów na których można uruchomić program) – co najmniej 5 |  |
| 6.3 | Urządzenie powinno być dostarczone z certyfikatem CE-IVD |  |
| 7.2 | Wbudowany inkubator komory pomiarowej 4-strefowy z możliwością ustawienia różnicy temperatur pracy górnych i dolnych grzałek w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na wieczku płytki, posiadający zakres temperatury pracy pomiędzy 4ºC a 70°C |  |

Otrzymują brzmienie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Zakres długości fali emisji w zakresie: 300-700 lub 270 -840 nm | …(należy wpisać) |
| 4.4 | Zakres dynamiki: min. 6 dekad | …(należy wpisać) |
| 4.5 | Czułość pomiaru w szybkim teście ATP: min. 7 amol/dołek płytki 96-dołkowej | …(należy wpisać) |
| 5.4 | Oprogramowanie do obsługi czytnika bez ograniczeń licencyjnych – w przypadku zaoferowania oprogramowania z ograniczoną ilością licencji (komputerów na których można uruchomić program) - liczba oferowanych licencji co najmniej 5 | …(należy wpisać) |
| 6.3 | Urządzenie powinno ~~być dostarczone z certyfikatem CE-IVD~~ posiadać certyfikat CE | … |
| 7.2 | Wbudowany inkubator komory pomiarowej 4-strefowy z możliwością ustawienia różnicy temperatur pracy górnych i dolnych grzałek w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na wieczku płytki, posiadający zakres temperatury pracy pomiędzy 4ºC względem temperatury otoczenia a 70°C | … |

2. W załączniku nr 4- Projektowane postanowienia umowy, zmienia się zapisy w sposób następujący:

Dotychczasowe zapisy dotyczące paragrafu nr 2 ust. 2 w brzmieniu:

Wykonawca do protokołu odbioru aparatury dołączy instrukcje aparatury, dokumenty gwarancyjne oraz certyfikat CE-IVD.

Otrzymują brzmienie:

Wykonawca do protokołu odbioru aparatury dołączy instrukcje aparatury, dokumenty gwarancyjne. ~~oraz certyfikat CE-IVD~~.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Dziekan Wydziału Chemicznego

(-) prof. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka